

SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

品名<Model Name>	(メモリハイコーダ<MEMORY HiCORDER>)	1/1
形名<Model Number>	(8832)	
製造番号<Serial No.>	(No.110812345)	
検査年月日<Test Date>	(2011-08-05)	
	<YYYY-MM-DD>	
検査条件<Test Conditions>	(23.0℃, 50%rh)	
電源周波数<Supply Frequency>	(60Hz)	

機能<Function>

No.	項目<Item>	結果<Result>
1.	プリンタ<Printer>	
-1.	セルフチェック<Self check>	(PASS)
-2.	ヘッドアップ<Head up>	(PASS)
-3.	ペーパーエンド<Paper end>	(PASS)
-4.	記録紙直線性<Paper feed precision>	(PASS)
-5.	マス目角<Printing condition>	(PASS)
-6.	紙送り精度<Paper feed accuracy>	(PASS)
2.	セルフテスト<Self test>	
-1.	ROM、RAM、チェック<ROM, RAM, check>	(PASS)
-2.	LEDチェック<LED check>	(PASS)
-3.	LCDチェック<LCD check(VIEW ANGLE)>	(PASS)
-4.	キーチェック<Keyboard check>	(PASS)
3.	ICカードテスト<IC card test>	(PASS)
4.	ストレージRAM<Storage RAM>	(PASS)
5.	X-Yレコーダ<X-Y recorder>	(PASS)
6.	トリガ<Trigger>	
-1.	INTトリガ<INT trigger>	(PASS)
-2.	トリガレベル<Trigger level>	(PASS)
-3.	トリガスロープ<Trigger slope>	(PASS)
-4.	トリガタイミング<Trigger timing>	(PASS)
-5.	EXTトリガ<EXT trigger>	(PASS)
-6.	トリガフィルタ<trigger filter>	(PASS)
7.	ユニット情報<Unit discrimination>	(PASS)
8.	時計<Clock>	(PASS)
9.	波形判定<Waveform Evaluation>	(PASS)
10.	メモリバックアップ<Memory Backup>	(PASS)

備考<Note>

1. オプションユニットは、別途検査とする。

<The optional units are inspected separately.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()